解説

角度分解紫外光電子分光

匂坂 康男

京都大学理学部化学教室

Angle-Resolved Ultraviolet Photoemission Spectroscopy

Yasuo Sakisaka

Department of Chemistry, Faculty of Science, Kyoto University, Kyoto 606

The basic principles and a few simple applications of angle-resolved ultraviolet photoemission spectroscopy as a tool capable of determining energy band dispersions (ε vs k) in solids will be given.

1. はじめに

光電子分光法は、物質に光を照射すると電子が 放出されるというアインシュタインの時代からよ く知られている現象(外部光電効果)を利用する もので、単色光の照射により放出される電子(光 電子)の運動エネルギー分布(光電子スペクト ル)を測定して物質内電子のエネルギー状態を調 べる分光手段である。1-3)光のエネルギーが約1 keV以上のX線を照射光(励起光)に用いる光電 子分光をX線光電子分光,数100eV以下の紫外光 の場合を紫外光電子分光と呼ぶ。また、測定試料 が多結晶や非結晶の場合または測定試料が単結晶 でも広い範囲の放出角で光電子を観測する場合に は角度積分光電子分光と呼ばれ、光電子スペクト ルはフェルミ準位以下の状態密度曲線を反映する。 単結晶試料を測定対象とし放出方向が数度以下の 立体角に限定された光電子を観測する場合には角 度分解光電子分光と呼ばれるが、これは二つに大

別される。一つは光電子数の角度分布から実空間 における原子の配列を調べる光電子回折法である が、本稿では割愛する。もう一つは、本稿の主題 であるが、実空間における光電子のエネルギーと 放出角度の関係を逆格子空間(k空間;kは波数ベ クトル)におけるエネルギーεとkの関係 [電子 エネルギー分散関係ε(k)]に変換してバンド構 造を求めるものである。この光電子スペクトルは ある特定のk値に対する状態密度を反映したk分 解光電子スペクトルである。

外部光電効果は1887年頃ヘルツによって発見さ れたが、アインシュタインの光量子説が出たのは 1905年である。その後、実験技術や電子状態理論 の進歩があって、光電子分光が物質内電子状態の 研究に本格的に使われるようになったのは1960年 代である。1970年頃から光電子分光は物質の表面 状態に敏感であることが認識され始め、表面の研 究にも応用されるようになった。1974年には希ガ ス共鳴線を励起光とする角度分解測定が層状化合物に対して実施され、バント構造が初めて実験的に求められた。しかし、この分光法が大々的に流行するのは1978年以降である。高強度、エネルギー連続性、偏光性など励起光として優れた特性を持つシンクロトロン放射¹⁾を利用する角度分解紫外光電子分光の実験は1975年に開始されていたが、1977年に電子軌道対称性選択則が発表されるまでs偏光とp偏光とで光電子スペクトルが異なる原因をつかめないでいたのである。その後、電子軌道の対称性を明確にしながらバンド構造を決定できる角度分解紫外光電子分光の種々の手法が発展し、⁴⁻¹⁰⁾最近では、電子のスピン状態も明確にする測定が実施されている。^{11,12)}

本稿は角度分解紫外光電子分光の実験をこれか ら始めてみたいと思っている人のために書かれて いる。従って、この分光法の原理と実施の仕方に 話の重点が置かれ、最近の話題の紹介を目的とし てはいない。この分光法による固体電子状態の理 解は一電子描像(バンド描像)の側からのアプ ローチであり、本稿ではサテライトなど多電子効 果の問題には立ち入らないことにする(多電子効 果の存在は一電子理論からの外れとして定量的に 認定される)。また、測定試料としては金属単結 晶、励起光としては直線偏光のシンクロトロン放 射を想定している。

2. 光電子分光の一般原理

光電子の放出を,半古典論的(現象論的)には, ①物質の仕事関数Φより大きいエネルギー Aωの 光を吸収して物質内電子が真空準位より上の準位 に励起される,②励起された電子の一部は,途中 非弾性散乱によるエネルギー損失なしに,物質の 表面へ輸送される,③物質の表面に到着した電子 が表面のポテンシャル障壁を乗り越えて表面から 離脱し真空へ放出される,というそれぞれ独立な 三段階の過程で考えることができる。¹³⁾この三段 階モデルでは,最初の電子励起は表面の影響がな いほど充分に深い所で生じると仮定し、三次元の kが保存されるバルク直接遷移に限定する。従っ て、表面準位が関係する光電子放出は記述できな い。一方、量子力学的な取り扱いでは、光照射に よって多体過程が起こった結果として光電子が放 出される、上記三つの過程が一体となった、一段 階過程である。14)この一段階モデルでは半無限大 結晶の電子準位を始状態とし、時間反転させた低 速電子回折状態(検出器までの全散乱事象を考 慮)を終状態とする電子遷移を扱い(この電子遷)
 移はkの表面平行成分k」のみを保存),よって 自動的に表面現象を包含し、電子や正孔の寿命 (または減衰;後述する非弾性散乱平均自由行程) と関連)も考慮できている。一段階モデルにより 計算された光電子スペクトルは強度も含めて実測 のものと直接比較できる。このように一段階モデ ルは三段階モデルより勝れているが、実験データ から分散関係 ϵ (k)を作るバンドマッピングが三 段階モデルでは容易なのに対し、一段階モデルの 場合、膨大な計算抜きの簡単な処方箋はない。電 子・正孔の減衰が充分に弱い場合には、一段階モ デルは三段階モデルに復帰する。

これまで実験データの解析は主に三段階モデル によって行われ、かなりの成功をおさめてきた。 非弾性散乱電子のスペクトルはバックグラウンド として扱って解析の対象から外したからである。 また光電子ピークもそのエネルギー位置のみ問題 にして、形状や強度は、補正の効果を摂動論的に 考察することはあるが、真っ正面からは取り組ま ない。実際, 励起光が p 偏光の場合, 三段階モデ ルで計算した光電子ピーク間の相対強度が実験結 果と一致しないのは当然として、一段階モデルの 計算でも、かなり改善はされるが、やはり不一致 は残る。15.16) これは表面における光の電磁場の 振舞いを単純にフレネルの式で考慮したためで, 表面付近に形成される局所場が重要であると考え られている [後出(5)式の▽・A項]。ここでは上 述したような様々な問題を内在してはいるが実用 的な三段階モデルのみを取り上げ,その各段階① ②③について説明する。

①光吸収による電子励起

電子数N個の系と電磁場(光)との相互作用を 半古典論的に扱う。摂動のないときの系のハミル トニアンをH。,基底状態,励起状態の固有関数 を $\phi_i, \phi_f,$ 固有値を E_i, E_f とする。充分弱い摂動 を $H(t)=Hexp(-i\omega t)$ とすると、 $\phi_i \rightarrow \phi_f$ 遷移 の単位時間当りの確率は、一次の摂動論の範囲で、

$$P_{fi} = (2\pi / \hbar) | < \phi_f | H | \phi_i > |^2$$

$$\delta (E_f - E_i - \hbar \omega)$$
(1)

と与えられる(フェルミの黄金則)。摂動が入射 光によるとする。電磁場を含めた系のハミルトニ アンは、電子の運動量演算子をP→P+(e/c)Aと して、

$$H=H_{0}+(e/2 mc)(A \cdot P+P \cdot A) - e \Phi+(e^{2}/2 mc^{2}) |A|^{2}$$
(2)

である。ここで、A、 Φ は電磁場のベクトルポテン シャル、スカラーポテンシャルである。適当な ゲージを選ぶと $\Phi=0$ とできる。また、高次項の $|A|^2$ を無視すると、

$$H = H_{0} + (e / 2mc)(A \cdot P + P \cdot A)$$
(3)
= H_{0} + (e / 2mc)(2A \cdot P - i\hbar \bigtriangledown \cdot A)
(4)

従って, 光吸収による遷移確率は,

$$P_{fi} \propto | \langle \phi_f | 2 \mathbf{A} \cdot \mathbf{P} - i\hbar \nabla \cdot \mathbf{A} | \phi_i \rangle |^2$$

$$\delta (\mathbf{E}_f - \mathbf{E}_i - \hbar \omega)$$
(5)

さて、 $A=A_0 \exp(iqr-i\omega t)$ は横波だから均一な 誘電体中では勿論 $\nabla \cdot A=0$ だが、不連続性を持 つ表面では $\nabla \cdot A \neq 0$ となる。このことは表面近 傍の電荷分布は不均一であり、よって縦型の電場 が形成されることを意味する。ωがプラズマ振動 数よりも大きいときにはこの縦型電場は固体内部 へ進行するが、小さいときは表面近傍に局在する。 電場勾配が大きいほど▽・Aは大きい。従って、 表面の局所的電磁場による表面光電効果はプラズ マ振動よりも低エネルギーの励起光に対してきわ めて重要となるが、高エネルギーの励起光に対し てはあまり重要ではない。

ここでは三段階モデルの精神に従って▽・A項 を落とすことにする。また,光の波長は格子定数 よりはるかに長いとして(紫外光に対しては勿論 成立),Aの空間的変化を無視する。そうすると (5)式は次式のように電気双極子遷移に対する形式 になる。

$$P_{fi} \propto |A_0 < \phi_f |P | \phi_i > |^2$$

$$\delta (E_f - E_i - \hbar \omega)$$
(6)

 $H_0, P, r間の交換関係を使い, H_0のポテンシャル をVとすると, (6)式は,$

$$P_{fi} \propto |A_{0} < \phi_{f}| |\mathbf{r}| |\phi_{i} > |^{2}$$

$$\delta (E_{f} - E_{i} - \hbar \omega) \qquad (7)$$

$$\propto |A_{0} < \phi_{f}| \bigtriangledown V |\phi_{i} > |^{2}$$

$$\delta (E_{f} - E_{i} - \hbar \omega) \qquad (8)$$

と書き換えられる

光電子放出の一電子遷移的振舞を強調する立場 をとる。N電子系の基底状態と励起状態の波動関 数をそれぞれ次のように書く。

$$\phi_i = \phi_i \Psi_i^{(N-1)} \tag{9}$$

$$\phi_{f} = \phi_{f} \Phi_{i,j}^{(N-1)} \tag{10}$$

 ϕ_i は光学的遷移する電子(i番目の軌道にある)の一電子波動関数, $\Psi_i^{(N-1)}$ は残りの(N-1)個の電子の波動関数, ϕ_i は光学的遷移により 生成された励起電子(光電子となる)の一電子波

-71-

動関数である。Φ^(M-1)はi番目軌道にホールを 生成する光学的遷移後の(N-1)電子系イオン状 態の波動関数で、イオン状態が取り得る種々の励 起状態のうちj番目の状態を表す。遷移確率は、 例えば(7)式の表示を使うと、

$$P_{fi} \propto |A_{0} < \phi_{f}| r | \phi_{i} > < \Phi_{i, j}^{(N-1)} | \Psi_{i}^{(N-1)} > |^{2}$$
(11)

光電子放出におけるエネルギー保存の関係を見 てみる。入射光のエネルギーを $\pi \omega$, N電子系基 底状態のエネルギーを $E_i^{(N)}$, 光電子放出後に残 された (N-1) 電子系のエネルギーを $E_i^{(N-1)}$ と 記す。系として金属を想定し,エネルギーの原点 をフェルミ準位 E_F にとる。この物質の仕事関数 (真空準位とフェルミ準位のエネルギー差)を Φ とする。光電子の運動エネルギー E_K を真空準位 から測ると, i番目のイオン状態に対して,

$$E_{\kappa}(i) = \hbar \omega + E_{i}^{(N)} - E_{f}^{(N-1)}(i) - \Phi$$
 (12)

が成り立つ。結合エネルギー *ε*_B(i)を,

$$\varepsilon_{B}(\mathbf{i}) = \mathbf{E}_{f}^{(N-1)}(\mathbf{i}) - \mathbf{E}_{i}^{(N)}$$
(13)

で定義すると,

$$E_{\kappa}(i) = \hbar \omega - \varepsilon_{\beta}(i) - \Phi$$

$$\varepsilon_{\beta}(i) = \hbar \omega - E_{\kappa}(i) - \Phi$$
(14)
(15)

という関係式が得られる。さて、基底状態で、光 電子放出される電子がエネルギー ε_i を持ち、残 りの (N-1) 電子がエネルギー $E_i^{N-1}(i)$ を持つ とすると、

$$\mathbf{E}_{i}^{(N)} = \varepsilon_{i} + \mathbf{E}_{i}^{(N-1)} (\mathbf{i}) \tag{16}$$

再び独立粒子近似で考え,光電子放出による電子 軌道の緩和はないとすると,

$$E_{i}^{(N-1)}(i) = E_{i}^{(N-1)}(i)$$
(17)

の筈である。(13)式と見比べて、

$$\varepsilon_B(\mathbf{i}) = -\varepsilon_i$$
 (18)

が得られる。即ち,光電子放出の実験から電子の 軌道エネルギーが求まる(但し,電子の軌道緩和 を無視したことに注意)。これはクープマンの定 理に他ならない。

ここまで述べた形式は結晶の周期性を利用して いなかった。周期ポテンシャル下での光学的遷移 を考えてみる。結晶中には格子と同じ周期性のポ テンシャルV(r)が存在していると仮定する。G を逆格子ベクトルとすると、V(r)は次のように展 開できる。

$$\mathbf{V}(\mathbf{r}) = \sum_{c} \mathbf{V}_{c} \mathbf{e}^{i c \cdot r} \tag{19}$$

独立粒子近似で考え、一電子状態はエネルギーバンドで記述できる(即ち、電子の還元波数ベクトルkは良い量子数である)と仮定する。よって、 始状態φ,と終状態φ,はブロッホ状態であり、両

$$-72-$$

方とも次式のような形に書ける。

$$\phi = \mathrm{e}^{i \, k \cdot r} \mathrm{u}_{l \, k}(\mathbf{r}) \tag{2}$$

 ℓ はバンドの番号である。さて、遷移確率は例え ば(8)式の形で与えられる。 $\nabla V(\mathbf{r}) = \Sigma_{c} GV_{c}$ $e^{ic\cdot r}$ に注意すると、

$$P_{fi} \propto |\sum_{G} \langle \phi_{f} | A_{0} \cdot GV_{G} e^{iG \cdot r} | \phi_{i} \rangle |^{2}$$

$$\propto |\sum_{G} \langle u_{m}(k_{f}) | A_{0} \cdot GV_{G} |$$

$$u_{n}(k_{f} - G) \rangle |^{2} \qquad (21)$$

k₁=k_i+Gである。このことは光学的直接バンド 間遷移はウムクラップ過程に他ならないことを示 している。

②励起電子の表面への輸送

光電子分光で用いる励起光のエネルギーは10 eV \leq f $\omega \leq$ 1500eVの範囲である。このエネル ギー範囲の光に対する物質の吸収係数 α は10⁵~ 10⁶ cm⁻¹程度であるから,光は物質に100~1000Å くらい侵入する。従って,電子励起の大部分は表 面近傍よりもむしろバルク内で起こっている。し かし,励起電子が光電子として観測されるために は物質中で非弾性散乱によるエネルギー損失(主 に電子間相互作用によるプラズマ励起)を受けず に表面まで到達しなければならない。図1に示す ように,物質中で電子がエネルギー損失を受けず に進みうる平均の距離(非弾性平均自由行程)は 電子のエネルギーが10~1500eVのとき約20Å以 下である(20~100eVの場合は3~5Åと非常に 短く,表面感度が高くなる)。

電子の速度分布と散乱は等方的と仮定し、散乱 を非弾性平均自由行程L(ε_f)の概念で扱って、 この輸送の問題を解く ($\varepsilon_f = \hbar \omega - \varepsilon_B$)。表面 から深さ z の所での光学的遷移により発生する励 起電子数は、そこでの光強度は表面での値のexp ($-\alpha z$)倍だから、 $\alpha \exp(-\alpha z)$ に比例する。ま た、励起電子が表面垂直から測って θ の方向に進



Fig. 1. Relationship between inelastic mean-free path length and electron energy with respect to the Fermi level.

んで、非弾性散乱せずに表面にたどり着く確率は exp[$-z/L(\varepsilon_f) \cos \theta$]である。従って、極 角 θ 方向のまわりd θ 内に到着する励起電子の数 は、

$$\int_{0}^{\infty} \alpha \exp[-\alpha z - z/L(\varepsilon_{f}) \cos\theta] \sin\theta /$$

$$2 d \theta d z$$

$$= \alpha L (\varepsilon_{f}) \cos\theta \sin\theta d\theta /$$

$$2 [\alpha L (\varepsilon_{f}) \cos\theta + 1] \qquad (22)$$

に比例する。③で述べるが、 θ には上限の臨界角 θ_{a} があるから、励起電子の総数を求めるには(22) 式を θ について $\theta = 0$ から $\theta = \theta_{a}$ まで積分すれ ばよい。結果¹³⁾は複雑なので詳しくは書かない が、非弾性散乱を受けずに表面まで輸送される確 率は、

$$D (\varepsilon_{f}, \omega) = C (\alpha, L, \theta_{c}) \alpha(\omega) L (\varepsilon_{f}) / \alpha(\omega) L (\varepsilon_{f}) + 1$$

$$\alpha(\omega) L (\varepsilon_{f}) + 1$$
(23)

となる。 $\alpha L/\alpha L+1$ は励起電子が表面に垂直な 方向に進んだ場合($\theta = 0$)の値であり, C (α , L, θ_{α})は角度分布の補正因子で,普通0.5~1の

値である。上述したように,紫外光領域ではα= 10⁻²Å⁻¹,L=3~5ÅであるからαL≪1,従っ て,

D $(\varepsilon_f, \omega) \sim \alpha (\omega)$ L (ε_f) . (24)

③光電子の表面からの離脱

エネルギーの観点からは、励起電子の運動エネ ルギーの表面垂直成分が仕事関数Φより小さいと きは表面から離脱できない(バルク内へ反射され る)。光学的遷移の終状態を自由電子的としてこ の事情を説明するのが図2である。E₀は終状態 バンドの底のエネルギーである。真空準位のエネ ルギーE_{vac}とE₀の差V₀=E_{vac}-E₀>0を内部ポ テンシャルと呼ぶ。光電子の放出角をθ_{ext},光電 子の運動量をTp,この光電子が物質内で持ってい た運動量をTK,その向きをθ_{int}としている。Tp は(14式で与えられる運動エネルギーE_xと次式 の関係がある。

$$E_{\kappa} = |\hbar P|^2 / 2m$$
 (25)

結晶の場合,表面に平行な方向では並進対称性は 崩れていないから,光電子放出の際,表面に平行 な運動量成分は保存される。即ち,pとKの表面

励起電子の物質内での運動エネルギーは、終状態 バンドの底から測ると、 $E_{int} = E_{K} + V_{0} = |\hbar K|^{2} / 2 m$ だから、|p| < |K|である。したがって、 $\theta_{ext} > \theta_{int}$ となる(電子の屈折)。光電子放出 の際、運動量の表面垂直成分は保存されない($K_{\perp} \neq p_{\perp}$)が、終状態を自由電子的と仮定すると K_{\perp} 値を求めることができる(5.1節)。真空準位 にある電子に対しては $K_{\perp} = \sqrt{2 m/\hbar^{2} V_{0}}$ であ る。これより大きい K_{\perp} でないと表面を離脱でき ない。従って、**図2**に示すように、 θ_{int} が、

$$\cos\theta_{c} = \sqrt{V_{0} / E_{int}} \tag{27}$$

で与えられる臨界角 θ_{e} より小さい場合のみ光電 子は表面から離脱できる。簡単な計算により、離 脱確率T(ε_{f})は, $E_{int} = \varepsilon_{f} + E_{F} - E_{0}$, $V_{0} = E_{F} - E_{0} + \Phi$ 故,



Fig. 2 Illustration of the escape conditions for a free-electron finalstate model.

(26)

となる。13)

(28), (29)式は、光電子が表面で例えばプラズモン 生成の非弾性散乱を受ける可能性を無視している。 これは $T(\varepsilon_f)$ をもっと小さくする働きをする。 また、結晶内での終状態はあくまでもブロッホ波 である。これが真空の波動関数と表面でうまくつ ながらないといけない。これも考慮されていない。 表面が関わる全ての効果を離脱確率に押し込めて しまっている。表面準位(5.4節)の存在は全 く考えに入っていない。

結局, 三段階モデルでの光電子数は, (21), (24), (28), (29)式を使って,

$$N(E,\hbar\omega) \propto \sum_{fi} \int d^{3}k P_{fi} D(\varepsilon_{f},\hbar\omega) T(\varepsilon_{f})$$
$$\times \delta [\varepsilon_{f}(k) - \varepsilon_{i}(k) - \hbar\omega]$$
$$\delta [E - \varepsilon_{f}(k)] \qquad (30)$$

で与えられる。 P_{fi} の k 依存性が小さく(数百 eVの光電子に対しては成立), P_{fi} DTのエネル ギー依存性が測定範囲で小さいとすると、(30)式は 結合状態密度のエネルギー分布を与える。さらに、 終状態は平面波で記述でき、状態密度は $\sqrt{E_{\kappa}}$ に 比例するとすると、高いエネルギー領域の狭い範 囲を考える限り終状態密度は一定としてよいか ら、(30)式は価電子帯の状態密度に比例することに なる。

4.角度分解紫外光電子分光の測定装置 と測定試料

図3の(a)には角度分解光電子分光の測定配置, (b)には測定に必要なもののうち基本的な低速電 子回折装置,オージェ電子分光装置,角度分解電 子エネルギー分析器のみを示した。超高真空排気 系,試料マニピュレーター,質量分析器,計測系, また測定試料にもよるが,希ガスイオン銃,蒸着 装置なども必要である。自作できるものもあるが, これらは全て市販されているし,よい解



Fig. 3. (a) Schematic drawing of the geometry of angle-resolved photoemission measurements. (b)Basic design of an apparatus for angle-resolved photoemission experiments.

説^{2. 17. 18)} もあるので詳述しない。ここでは**図** (b)に示した基本的構成部品の果たす役割と測定 試料に対し注意すべき点だけを述べる。

紫外光電子分光では価電子帯から放出される 20~100eVの光電子を観測する。このような電子 の非弾性平均自由行程はL=3~5Å(図1)と 極めて短い。L=5Å,面間隔を標準的な2.5Åと した場合,光電子数の40%は表面第一層から,25 %は第二層から,15%は第三層から放出されるこ とになる(第三層までで全光電子数の80%)。 従って,試料の表面状態(結晶性と清浄さ)が測 定結果に非常に重要な影響を与える。

4.1 測定試料

アルカリ金属など特別なものを除いて、大抵の

-75-

単純金属や遷移金属の単結晶は市販されている。 国産品も一部あるが、筆者の経験では外国品の方 がはるかに結晶性が良い(当たり外れはあるが)。 清浄表面の作成法について文献18に解説がある。 W表面は真空中での高温加熱により清浄化できる が、他の金属の場合は希ガスイオン衝撃・アニー ル法によるしかない。気体分子の表面吸着確率を 最大の1とすると、1×10⁻¹ Torr の超高真空中 でも約1時間で0.1単原子層の表面不純物が蓄積さ れる。主な残留気体であるHやCOの吸着物のよ うに試料加熱で簡単に除去できることもあるが、 H,Oの解離吸着物は試料加熱では除去できない。 バルク中の不純物も表面に偏析する。熱拡散を押 さえるためには試料を冷却する必要がある。市販 されていないような試料の表面清浄化は極めて困 難と思った方がよい。合金の表面がその例である。

真空蒸着膜は格子欠陥や歪みを多く含む。劈開 法も表面欠陥を作るようである。ヤスリ掛け法は 無論本稿の目的にそぐわないが,瞬間的に1000℃ 位までの温度上昇による分解の懸念があるし,逆 汚染の可能性もある。

4.2 オージェ電子分光^{17.18)}

この手段は表面の清浄さ(表面不純物の種類と 濃度)を調べるのに最もよく使われており,表面 層約10Åを定量的かつ非破壊的に調べることがで きる。特に,代表的な表面汚染物質であるC,N, O,S,Clなどの軽元素の検出に適している。検出 感度は0.01%単原子層である。円筒鏡型電子エネ ルギー分析器を使う。これまでに蓄積されたデー タと比較することにより,金属のオージェピーク との相対強度から吸着量を見積もることが容易に できる。

オージェ電子分光より検出感度の高い表面分析 手段として二次イオン質量分析がある。感度は 10⁻⁶単原子層と高いが非定量的で破壊的である。 内殻線を観測するX線光電子分光の検出感度は数 %単原子層程度とあまりよくない。紫外光電子分 光は表面不純物の分析手段として全く不適である。 不純物の種類を同定できないし,光電子ピークと して出現しないこともあるからである。

4.3 低速電子回折¹⁸⁾

角度分解光電子分光によりバンドマッピングす るには光電子がコヒーレントに放出される必要が あるから表面第一層の結晶性が重要である。表面 第一層の結晶性は低速電子回折(または反射型高 速電子回折)で調べる。回折スポットが鋭く、 バックグウンドとの強度比が大きくてコントラス トがよい必要があるが、だからといって表面欠陥 がないとは言えない。今の所、表面欠陥を検出す る有効な表面分析手段はないが、低速電子回折も 表面欠陥にそれほど敏感ではない。注意深く作成 されたCu単結晶表面にも1~2%単原子層の表 面欠陥が存在すると言われているが、低速電子回 折像には反映されていない。

4.4角度分解電子エネルギー分析器

現在は静電場型のエネルギー分析器が使われて いる。その種類と特徴などについてはよい解 説¹⁹⁾があるので省略し、ここでは角度分解紫外 光電子分光に用いられている分析器の性能(エネ $ルギー分解能 \triangle E と 角度 分解能 \triangle \theta$) についての み述べる。これまでの実験では大抵△E=100~200 $meV, \Delta \theta = 2^{\circ} \sim 4^{\circ}$ であったし、市販され ていたエネルギー分析器もこの程度の実用分解能 が出せるものであった。それには理由がある。ブ リルアンゾーンの大きさは2^{A⁻}程度だが,これ の10分の1のk分解能でバンドマッピングできれ ば十分であろうというものである。最近、フェル ミ準位ごく近傍の情報に関心が高まったりして, 高分解能化が一つの流れになっている。励起光が シンクロトロン放射の場合に $\triangle E=70 \text{ meV}, \triangle \theta$ = 0.6° ($\hbar \omega > 25 \,\mathrm{eV} \mathcal{O} \geq \mathfrak{E}$), $\Delta \mathrm{E} = 32 \,\mathrm{meV}$, $\Delta \theta = 2^{\circ}$ (れ $\omega < 20 eV O ber b), 希ガス共鳴線の$ 場合に $\triangle E = 20 \text{ meV}, \triangle \theta = 0.3^{\circ}$ (角度積分型の





場合は $\triangle E=12 \text{ meV}$)の実施例がある。 $\triangle E= 数$ meVの市販品も見かけるようになった。 $\triangle E$ 値 $\ge \triangle \theta$ 値は測定時間やSN比と深く関連する。研 究目的に応じた性能のエネルギー分析器を選ばな ければならない。

5.角度分解紫外光電子分光の原理

独立粒子近似が成り立ち,一電子状態はエネル ギーバンド ε (k)で記述できるものとする(kは還 元波数ベクトル)。3. で述べた話に従えば,図4 に示すように,仕事関数Φの結晶にΦより大きい エネルギー $\pi \omega$ の光を照射すると,フェルミ準位 ($E_{F}=0$)よりも下の始状態 ε_{i} (k)の電子が真空 準位($E_{\mu a c}=E_{F}+\Phi$)より上の終状態,

$$\varepsilon_{f}(\mathbf{k}) = \varepsilon_{i}(\mathbf{k}) + \hbar \omega \tag{31}$$

に直接バンド間遷移され,光電子が運動エネル ギー,

 $\mathbf{E}_{\kappa} = \boldsymbol{\varepsilon}_{i}(\mathbf{k}) + \hbar \boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\Phi} = |\hbar \mathbf{p}|^{2} / 2 \mathbf{m} \quad (32)$

で放出される(ħ p は光電子の運動量)。ここで、

 $\varepsilon_{i}, \varepsilon_{f}$ は E_{F} を基準とし, E_{K} は E_{sac} を基準として いる。 **3**. で述べたように, 遷移確率の影響は受 けるが, 価電子帯の状態密度を反映した光電子ス ペクトルが観測される筈である。

励起光は直線偏光とする。図2に示したように、 光の入射角を θ_{i} 、ベクトルポテンシャルをA、光 電子の放出角を θ_{ext} とする。200式の説明で述べた ように、結晶からの光電子放出の際、運動量の表面 に平行な成分は保存されるから、 $p_{\parallel} = |\mathbf{p}_{\parallel}|$ は

$$p = \sqrt{(2 m/\hbar^2) E_K} \cdot \sin \theta_{ext}$$
(33)
= | k₁₁+G_{B11}+G_s | (34)

となる。ここで、 G_{μ} はバルクの逆格子ベクトル (三次元)、 G_{s} は表面の逆格子ベクトル (二次 元)である。これはエネルギー保存の関係則(32)式 とこの(33)式に従って $\hbar \omega \ge \theta_{sx1}$ を選ぶと、任意 の k_{μ} 値を持った固体内電子を選択的に観測でき る事を意味する。 $G_{\theta_{\mu}}+G_{s}=G_{\mu}$ とおき、拡張 ゾーン方式での波数ベクトルをKと書くと、

$$p_{\parallel} = K_{\parallel} = k_{\parallel} + G_{\parallel}$$
 (35)

であるから,角度分解(k₁分解)光電子スペクト ルN(E,K₁, ħω)は,(30)式の角度積分型のもの を,

N(E,K₁, ћ
$$\omega$$
)∝ Σ_{if} ∫d³k[(30) 式の被積分
項]× δ (k₁+G₁-K₁) (36)

と変更して与えられる。

層状物質の電子構造や表面準位(5.4節)の ように二次元性であることが始めからわかってい る場合は、 $\hbar \omega = - co$ 条件で、光電子ピークの エネルギー値を θ_{ext} の関数として測定し、(33)、 (34) 式を使って $k_{||}$ を決めれば、 $\varepsilon_i (k_{||})$ が問 題なく求まる [後で述べるが、実質的には(35)式で $k_{||} \parallel G_{||}$ としてよろしい]。 表面準位に対する実施例を一つ示す。図5の (a)はフェルミ準位近傍におけるCu(111)の光電 子スペクトルで, Ar I 共鳴線を励起光とし, $\theta_{ext}=0^{\circ}$ (k₁₁=0, 下点)を中心に θ_{ext} を[211] 方向とその逆方向に変えて測ったものである²⁰⁾ (ペアのピークのうち,深い方は励起光のサテラ イト線による)。このピークはL点付近のs-pバ ルクバンドギャップ内に存在する表面準位で,そ のエネルギー位置は h ωに依存しない。(33)式に よって求めた k₁₁に対し,ピークのエネルギー位 置をプロットしたものが(b)である(下, ∑など は後出の図16に示す表面ブリルアンゾーンの対称 点と対称軸)。斜線部は表面に投影されたバルク バンド構造である。 結晶表面に垂直方向の並進対称性は崩れている から,運動量の表面垂直成分は保存されない。図 6 は逆格子を模式的に示している。逆格子はバル ク(三次元)では点で表わされるが,表面(二次 元)ではロッドで表わされる。(34式との対応で言 えば表面が供給するG_⊥は0から∞までの連続値 をとるから, p_⊥は離散値に制限されない。つまり, p_⊥値が決まるのであって, p_⊥値とk_⊥の間に直 接の相関はない。しかし,我々は,バンド計算が 出しているようなエネルギーバンドの ϵ -k分散 曲線を,複雑な計算をせずに,簡単に実験データ から直接描こうとしているのだから, k_⊥値をなん とかして決める必要がある。



Fig. 5. (a) Off-normal emission spectra for the Cu(111) sp surface state in the Γ KLUX plane. (b) Energy dispersion relation for the surface state (●○).





5.1 k₁の決定法

 k_{\perp} 値 [あるいは $\varepsilon(k_{\perp})$] を決める代表的な 方法に次の5つがある: ①終状態を自由電子的 バンドで近似する方法, ②三角測量法, ③ブリル アンゾーン境界面におけるバンドのギャップを利 用する方法, ④量子井戸状態を利用する方法, ⑤ 表面放出を利用する方法。①~④のどの方法でも 求まった k_{\perp} 値は $\pm 2 \sim \pm 5$ %程度の誤差を含む が, 方法①では k_{\perp} 値を求めるのに自由電子的な 終状態バンドを仮想せざるを得ないのに反し, 方 法②~④ではそのような仮定をせずに絶対的に k_{\perp} 値を求めることが出来る。しかし, ここでは ①についてのみ詳述し, ②~⑤については簡単に 述べる。

①自由電子的終状態モデル

もし終状態バンドの分散関係 $\varepsilon_{f}(\mathbf{k})$ が既知な ら原理的には k_{f} は決まり, k_{\perp} も求まる筈である (例えば図2)。さて、この図2のように、終状 態を一本の自由電子的バンドで近似できるとする (実際,できる場合が多い)。このバンドは内部 ポテンシャルと呼ばれている $V_{o}=E_{yac}-E_{0}$ と電 子の有効質量m*の二つのパラメーターで記述される。この近似の妥当性を具体的な例を用いて説明する。

Cu(001) 面に垂直な方向([001] 方向)に放 出される光電子を観測する ($\theta_{ext}=0^{\circ}$ 故 k $_{\parallel}=0$, またk |||[001])。[001] 方向は逆格子空間ではΓ - △-X軸に対応するから, 光電子を生む光学的 遷移はΔ軸上で起こっている筈である。バンド計 算で求まっているΔ軸上のバンド構造を, Γ-X -Γを横座標にして,図7の(a)に示した。但し, 左側のΓ-Xには全てのバンドを書いたが、右側 のX-Γには、この軸上での許容遷移に関与でき る対称性のバンドのみを示した。選択則(5.2 節)によれば、この面からの垂直光電子放出の場 合,終状態の対称性は△」でなければならず, 従って許される始状態は△」と△₅の対称性のもの だけとなる。 hωの光を照射すると矢印で示した ように直接バンド間遷移が起こり、励起電子は真 空へ運動エネルギーE_Kで放出される((b)),最 後にエネルギー分析器により光電子スペクトル $N(E_{\kappa})$ として観測される ((c)), といったこと は前述の通りである。重要なことは、△」対称性 の終状態ならばどれに励起されても光電子は表面 から垂直に放出されるわけではない、ということ である。つまり、(a)で上位のG220と記したΔ1 バンドのX点に近い所や下位のG₀₀₂と記したΔ₁ バンドのΓ点に近い所へ遷移した場合,光電子は 表面から垂直には放出されない。これは還元ゾー ン方式ではなく拡張ゾーン方式で考えると理解し やすい。まず、周期ポテンシャルの大きさがゼロ の空格子を考える。この場合の自由電子波eiK・r =e^{i(k+G)}・rはK=k+G方向に進行する平面波で (ここでは $K \equiv k \mid || [001]$), そのエネルギー ε , は,

 $\varepsilon_{f} = \hbar^{2} (k+G)^{2} / 2m + E_{0}$ (37)

である。周期ポテンシャルを働かすと、ブリルア



Fig. 7 · Schematic representation of band structure determination using a free-electron final state (dotted curve).

ンゾーンの境界面でギャップが生じる。次に、 種々のGに対するバンドを還元ゾーンに折り畳み、 さらに同じ対称性のバンドが交差する所に混成に よるギャップを作って出来たものが図7(a)のバ ンド構造である(終状態に興味があるから3d準 位は無視した)。図7(a)に記されたG₀₀₂,G₁₁₁, G₂₂₀は還元に使った逆格子ベクトルである。さ て、終状態の波動関数 $\phi_{f,k}(\mathbf{r})$ はブロッホ波であ るから、

$$\phi_{f,k}(\mathbf{r}) = \sum_{G} C(G,k) e^{i(k+G) \cdot \mathbf{r}}$$
(38)

と平面波で展開できる。図7の場合, k = k $_{\perp}$ は Δ 軸上にあって, [001] 軸に平行である。従って, (30) 式で表わされる終状態が遷移許容な Δ_{\perp} 対称性を 持っていても、もしG || [001](即ちG || k)でな い場合(例えばG $_{220}$),励起電子は、表面垂直の [001] 方向ではない、あらぬ方向へと走り出す。 つまり, (30)式右辺の展開項のうち, G || [001] の平 面波成分のみが重みC(G_{002m},k)で(001)面 の垂直光電子放出に寄与する(mは整数)。図7 (a)に, G_{002m}成分の多い部分を太線で示した。 これを切式の自由電子的バンド(図の点線)で近 似しようとするのであるが、無理な領域がある (結論を言うと、近似できる領域だけで使う)。 例えば、約10eVより下のギャップ領域は全く近 似できないが、この領域では元々光学的遷移はな く、従って、光電子放出もない(だから心配しな くてよい)。一般的に言って,低エネルギー領域 では自由電子的終状態モデルを使わない。ブリル アンゾーンの境界面でのギャップや混成による ギャップの中ではこのモデルは破綻しそうである。 しかし,経験的には、奇妙にと言うべきか幸いと 言うべきか、2~3eVくらいまでのギャップな ら問題がない。これは終状態の寿命幅のためと説 明されている。ただし、ギャップの効果はピーク の強度変化として現われ、下記③のブラッグ面法 で利用される。ここの方法では、強度は問題とせ

ず, ピーク位置にのみ注目するのである。そして, 二つのパラメーターV。とm*でうまく調節しなが ら, 近似できそうな領域にだけ適用する。

図7(a)を見てわかるように、終状態がk」分 散を持つから、 ħωが変わると光電子放出に関わ る始状態も別のk」のものに変わる。つまり,k」 =一定の条件で測定した光電子スペクトル中の ピーク位置が πωとともに変化する。 勿論, これ $d\varepsilon_i ok_j 分散を反映したものに他ならない。$ 図8に一つの測定例を示す。これはCu(111)面 からの垂直放出スペクトル ($\theta_{ext}=0$)を6.0eV ≦ h ω ≦ 11. 5eVの範囲で測定したものである。²¹⁾ hωを変えてもエネルギー位置の変わらな いフェルミ準位直下のピークが図5で述べた表面 準位に起因するものである。約-2.5eVのあまり 市ω依存性を示さないピークは3dバルクバンド に起因する(Cuの3dバルクバンドのk分散は 元々小さい)が、それ以外に fω = 11.5eV での -3.3eVからhω=6.5eVでの-1.5eVまで移動 するピークが観測されている。これは4sバルク バンドからの放出ピークである。

以上述べたことにより、自由電子的終状態モデ ルでは、垂直放出の場合、 $\varepsilon_f - E_0 = E_K + V_0$ であ るから、K₁= | K₁| = | k₁+ G_{*B*1} | の値は、(37) 式から、

$$K_{\perp} = \sqrt{(2 \text{ m}^{*}/\hbar^{2})(E_{\kappa} + V_{0})}$$

[垂直放出の場合] (39)

で与えられる。また、斜め放出($\theta_{ext} \neq 0$)の場 合は次式で与えられる。

K₁=
$$\sqrt{(2 \text{ m}^*/\hbar^2)(E_{\kappa}\cos^2\theta_{ext} + V_0)}$$

[斜め放出の場合] (40)

ところで, k || G, 即ちk_i || k_iの光電子放出を primary cone emission, それらが平行でない場 合のものはsecondary cone emissionと呼ばれ



Fig. 8. Normal-emission spectra of Cu (111) measured at $6 \cdot 0 \le \hbar \omega \le 11 \cdot 5 eV$.

る。また、後者のものが観測されたとき、ウムク ラップ過程によって見えた、などと言う。ウムク ラップ散乱過程により光電子の進行方向を観測方 向に変える必要があるからである。従って、secondary cone emissionは primary cone emissionと比べると強度が1桁から2桁弱く、普通は 滅多に観測されない。

このモデルの具体的な使用手順は以下のような ものである:(a)バンド計算結果があるならそれを 見て、このモデルが適用できそうな領域(つまり れω領域)を探し、ついでにフィッティングによ りV₀とm*の値を決める(一組のV₀とm*はゾー ンの境界に達するまでしか使えないことが多く、 それより上は改めてV₀とm*の値を設定し直す)、 (b)光電子スペクトルを測定して(最初の測定は 垂直放出スペクトルが普通なので、以下、垂直放 出の場合に限定する)、ピーク位置がれω依存性 を持つことを確認する(不幸にしてれω依存性が ない場合は下記の⑤を参照)、(c)(3)式により求め た K_{\perp} に対しピークのエネルギー値 ε_i をプロッ トする,(d)対称点(図7では Γ 点とX点)で始 状態バンドが正しく極小または極大になり,かつ (左右)対称的になるよう V_0 とm*の値を設定し 直す(V_0 は対称点の絶対位値に,m*は間隔に関係 する)。

②三角測量法²²⁾

k₁₁の保存則だけを頼りにする方法で,地形測 量の場合と全く同じ原理を使う。図9に示すよう に,異なった指数の結晶面AとB [図ではAが (111)面,Bが (110)面]からの光電子スペク トルをれωは一定にして放出角 θ_{ext} だけを変え て測定し(図ではFCC結晶の (110) ΓKLUX 鏡映面上で測定),ピークの数とエネルギー値が 両面で同じになる $\theta_{ext} = \theta_A \ge \theta_{ext} = \theta_B$ を探す。 このエネルギー一致を同じk点での光学的遷移を 別々の面で観測したと認定する(果たしてそう か?という疑問は残る)。図に示すように,k_A と k_B を各表面に投影する線(破線)の交点が求め るk点を与える。エネルギー一致の条件を使うの でこの方法はenergy coincidence methodとも 呼ばれている。

③ブラッグ面法

終状態バンド(普通,自由電子的)がブリルア ンゾーンの境界面(ブラッグ面と呼ぶ)でギャッ プを作ることを利用する方法で,k の保存則のみ を頼りにする。これには $\hbar \omega$ を一定にして θ_{ext} を変える手法^{23,24)}と θ_{ext} を一定にして $\hbar \omega$ を 変える手法²⁵⁾の二つがある。前者の手法をCuの 場合を例にして先に説明する。ある曲面を,

$$\Omega_{fi}(\mathbf{k}) = \varepsilon_{f}(\mathbf{k}) - \varepsilon_{i}(\mathbf{k}) - \hbar \omega = 0$$
⁽⁴¹⁾

で定義する。バンド間遷移はこの曲面上で起って いる。 $\mathbf{k}+\mathbf{G}=\mathbf{K}$ を使って、 $\Omega_{fi}(\mathbf{k}) \rightarrow \Omega_{fi}(\mathbf{K})$ 、 $\varepsilon_{f}(\mathbf{k}) \rightarrow \varepsilon_{f}(\mathbf{K})$ と書き替え、拡張ゾーン方式で



Fig. 9. Principles of the triangulation method for the absolute determination of the locations of direct transitions in k space.

(41)式の曲面を考える。Cuのバルクバンド計算結 果に基づいて下から5番目のバンド(3dバンド の一つ) $\varepsilon_i(\mathbf{k})$ から $\hbar \omega = 21.2 \text{eV}$ 上の終状態 ε_i (K)への電子遷移に対する曲面を計算する(なか なか厄介な計算である)。図10の太い実線は(110) ΓKLUX鏡映面によるこの曲面の切り口(曲 線)を示すが、これを一定エネルギー差曲線(CE DC)と呼ぶ。この曲線が円形に近いのは始状態 のk分散が小さく、終状態が自由電子的でk分散 が大きいことを考えると理解できる。勿論、ブ ラッグ面ではギャップが存在し、不連続になって いる。また、ブラッグ面を境に終状態の対称性も 変化する。 $f \omega = 21.2 eV - cox eV - cox$ えながらこの鏡映面上で光電子スペクトルを測定 する。 θ_{ext} の変化とともにバンド間遷移は図の 太線上をなぞってゆく。そしてギャップに到達す るとバンド間遷移は消失し、ピーク強度は急に減 少する筈である(ゼロにはならない;後述参照)。 ギャップを通過すると別の対称性の異なる終状態 へのバンド間遷移が現われ、ピーク強度は再び増 すがエネルギー位置は違う筈である。このような ピークの変動が起こったときの θ .x, からK1 が



Fig.10. Cut through the extended-zone scheme(rKLUX mirror plane). The thick solid lines are the CEDC's, and the thick dashed lines are the CEAC's.

④量子井戸状態を利用する方法

伝導電子の量子力学的波長と同程度の厚み(~ 100Å)をもつ半導体超薄膜の二次元電子系が最 近興味を持たれているが,量子井戸はもともとそ のような二次元電子系に対して提案された概念で ある。薄膜とそれを挟んだ物質の電子親和力の差 により箱形ポテンシャルが形成され,薄膜層に電 子が閉じ込められる。電子の波動関数は膜に垂直 方向には定在波化されるが,膜に沿う方向では自 由電子として振舞う(光導波路と類似)。このよ うに量子力学的な閉じ込みが可能な薄膜を量子井 戸と呼ぶ。

金属超薄膜での量子井戸状態に対する研究は進展していない。それはさておき、量子井戸効果を利用して ε (k_{\perp})分散関係を決めることができる。まず問題の背景を述べる。図11に垂直光電子分光

実験で求めた(①の手法). Γ-L方向におけるAg バルクバンド構造を示す(白丸がデータ点)。²⁶⁾ -4~-7eVの構造はdバンドのものである。こ こで関心があるのは-4eV以上のsバンド構造 である。-1.5eV以上にはデータ点がないことに 注意して頂きたい。フェルミ準位直下-0.12eVに 存在する半値幅≦50meVの表面準位が邪魔した ためと考えられている(エネルギー分解能は△E ~100meVであった)。これには文字通りの意味 以外に別の機構がある。sバンドピークの強度は フェルミ準位近傍の表面準位に接近するにつれ急 激に弱くなる。これはs電子が表面準位に吸い取 られたため、と考えられている。しかし、表面準 位がなくともフェルミ準位近傍では光電子ピーク の観測は困難となる。まず、s電子に対する原子の 光電離断面積は極めて小さいから,元来,sバンド の光電子ピークも弱くて観測しにくい。また、 フェルミ準位から△E以内の領域ではピークのシ フトなど原理的に測定できないことは勿論である。 蛇足ながら、△Eを小さくして高分解能化すれば 全てが解決される、と思うのは短絡すぎることを 注意しておきたい。実際の結晶表面には必ず表面 欠陥が存在する。表面欠陥による散乱効果のため



Fig.11 Plot of measured binding energy vs wave vector along the Γ−L line for the normal– emission results from Ag (111).

電子の寿命が短くなり、フェルミ液体論に反し フェルミ準位に接近するにつれピーク幅は増大す る。電子-フォノン散乱の効果は低温化で抑える として(電子-電子散乱による寿命幅は通常無視 できる),フェルミ準位近傍ではもう一つ厄介な 問題がある。真空準位より上のエネルギー領域で は、固体内に少しだけ侵み込む真空側の波動関数 が必ずある(5.4節参照)。これをevanescent state(減衰状態)と呼ぶ。表面近くに存在する 電子がこの減衰状態へ遷移して、するりと真空へ 流れ込む表面放出の過程が必ず存在する。強度は バンド間遷移のものに比べ1~2桁弱いが、フェ ルミ準位のごく近傍にも常駐しているから、強度 を弱めながらフェルミ準位に接近するピークの観 測を妨害する(バンドのフェルミ準位クロッシン グの観測にも大きく関わる)。フェルミ準位近傍 は光電子分光にとって鬼門と言えよう。

量子井戸効果の利用は上述した問題の一つ(表 面準位の陰に隠れた上の方のバンド構造)をある 程度解決する。但し、試料に特別な条件が要る。 Cu(111) 面上のAg蒸着薄膜のように, きれいに エピタキシー成長すること、その薄膜は本来の格 子定数をもつこと、の条件である。図12はCu(111) 面にエピタキシー成長させたAg(111)薄膜の垂直 光電子スペクトルを示す(fiω=10eV)。²⁷⁾ 単原 子層(ML)を単位とした膜厚を各スペクトルに記 してある(43MLで約100Åの膜厚)。フェルミ準 位直下の大きなピークが表面準位によるものであ る。その下に見える番号付けした幾つかの弱い ピークに注目して頂きたい。これらは、Cu金属と 真空に挟まれたAg薄膜内における, Ag s電子の 量子井戸状態によるピークである。定在波存在の 位相条件は,

$$2 k_{\perp}(\varepsilon) d + \delta(\varepsilon) = 2 n \pi$$
(42)

である。ここで、dは膜厚、 δ はCu-AgとAg-真空両界面での位相シフトの和、nは整数(量子





数)である。(42)式中の $k_{\perp}(\varepsilon)$ を求めたい。 図13はdに対してピーク位置をプロットしたもの で,点を結んでdを連続量として扱う。ある ε , 即ちある $k_{\perp}(\varepsilon)$ と $\delta(\varepsilon)$ を選ぶと種々のdと 対応するnが定まる。(42)式を使って $k_{\perp}(\varepsilon)$ と $\delta(\varepsilon)$ を求める。同じ手続きを別の ε 値にも 実施して求まった $k_{\perp}(\varepsilon)$,即ち $\varepsilon(k_{\perp})$ が図14 である。これは-1.5eVより上のバンド構造を与 えている。しかし,最上端のデータは得られない。 現在の光電子分光の限界と言える。

⑤表面放出法

光学的遷移の終状態がエネルギー的にバンド ギャップ内にある場合でも、④で述べたように減 衰状態を終状態とする電子遷移は起こり得、弱い 表面放出はある。この場合、 k_{\perp} は重要でなく、あ る特定の k_{\parallel} に対する一次元状態密度(k_{\parallel} 分解状 態密度)を反映したスペクトルが得られる(k_{\parallel} 一 定の条件で h ω を変えてもピーク位置は不変)。 ある対称軸に沿って θ_{ext} を変えて表面放出スペ クトルを測定し、観測されたピーク値を $e^{-k_{\parallel}}$ プロットとすると、その対称軸上のバルクバンド



Fig.13. Plot of measured energy positions of the first four quantum-well states vs Ag overlayer thickness.



Fig.14. Experimentally determined Ag sp-band dispersion along Γ−L.

構造が得られる(ことがある)。状態密度は対称 軸上で大きいからである。但し,一次元状態密度 のピークは対称軸から外れたバンドの平らな領域 にも起因することに注意を払う必要がある。

5.2 電子軌道対称性選択則

-85-

我々は,角度分解光電子スペクトルを測定する ときに,始状態の空間対称性とスピン対称性を明 確にしたいと考えている。そのための選択則につ いて説明する。

励起光が直線偏光の場合の非相対論的な電子軌

道対称性選択則^{**)} を表1と表2にまとめた。こ れは空間対称性についてだけの選択則である。表 2では、簡単のため、FCCやBCCの構造をもつ立 方格子結晶の(100),(110),(111) 面のみを考え ている。さて、この選択則を理解するに鏡映面を 認識しておく必要がある。

FCC格子とBCC格子の三次元プリルアンゾー ンを図15に示す。ついでに、各面に対する二次元 の表面プリルアンゾーンを図16に示しておく。二 次元プリルアンゾーンの対称点と三次元プリルア ンゾーンの対称点とは密接な対応関係がある。こ れを図17に示す。

FCCやBCC格子には二種の鏡映面がある(図 15)。即ち,FCC格子のΓKLUX [(1Ī0)] 鏡映 面とΓKWX [(001)] 鏡映面,BCC格子のΓHP N [(1Ī0)] 鏡映面とΓHN [(001)] 鏡映面であ

Table 1.	Non-relativistic dipole selection rules for
	emission in a mirror plane when linearly
	polarized light is employed.

鏡映面内放出の場合	【放出面	(検出面)	=鏡映面]
-----------	------	-------	-------

遷移モーメン	ヽ =<終状態│A・P│始状態>
A 検出面	<偶対称 偶対称 偶対称>
A 上検出面	< 偶対称 奇対称 奇対称 >

る。(001) 面と(110) 面には二種の鏡映面がある が、(111) 面には一種の鏡映面しかない(FCCの ΓKWX面やBCCのΓHN面は鏡映面でない)。

鏡映面に関し波動関数は偶または奇の対称性の いずれかを持つから,角度分解紫外光電子分光で は、光電子の検出を鏡映面内で行う(図15の斜線)



Fig.15. The bulk Brillouin zones of FCC and BCC lattices.

	pola	rized light is	employed.	n iineariy
垂 結晶面	直放出の 終状態	場合(立方格子	子のとき) - 非相 許される始状態	I対論的 R
(100)面	Δ 1	A ∥ [001] Δ₅	A [010] Δ ₅	
(110)面	Σ 1	$\begin{array}{c}A \parallel \begin{bmatrix} 001 \end{bmatrix}\\ \Sigma_3\end{array}$	$\begin{array}{c} A \parallel \begin{bmatrix} 1\overline{1}0 \end{bmatrix} \\ \Sigma_{4} \end{array}$	A [110] Σι
		1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		6

の入った面内だけをエネルギー分析器は右往左往 する)。従って,

大事な約束①:光電子の検出は鏡映面内で行う (検出面=鏡映面)

励起光である直線偏光のベクトルポテンシャルA も特別な配置にして, 鏡映面に関して偶奇の対称 性を持たせる。p偏光(s偏光)の入射面をある鏡 映面に平行または垂直にすると, Aの表面平行成 分A₁₁はその鏡映面に関し偶対称(奇対称)また は奇対称(偶対称)にすることが出来る(表面垂 直成分A₁は常に鏡映面に偶対称)。つまり,

大事な約束②:光の入射面は検出面に平行または 垂直である。

鏡映面が検出面の場合,終状態の波動関数は鏡映 操作に対し偶対称でなければならない。もし奇対 称であると波動関数は鏡映面 = 検出面で常に node(節点)を持ち,光電子強度はゼロになっ てしまう。

表1の選択則を説明する。(5)式から表面光電効 果の項▽・Aを落として考える。そうすると,遷 移モーメント∝<終状態 | A・P | 始状態>と表 される。終状態は検出面=鏡映面に関し偶対称で なければならない(上述)。運動量演算子Pは検

fcc(001) fcc(110) fcc(111) [001] [112] [110] $\overline{\Delta}$ ίī [100] [1]ס[-1101 īk=<u>1</u>2 Ēx=12 - 2 $\overline{\Gamma}\overline{\gamma} = \frac{\pi}{2}$ $a \cos^2 30^{\circ}$ ΓM=2π ΓX=12-2 cos 30 FS= 13 m

bcc (001) bcc(110) bcc(111) [110] [112] \overline{N} [110] ⊼¦ [001] [110] [100] ŝ $\frac{\pi}{\sqrt{2a}\cos 30^\circ}$ $\overline{\Gamma}\overline{X} = \frac{\pi}{2}$ $\overline{\Gamma}\overline{N} = \sqrt{2}\frac{\pi}{2}$ ГМ= FH= 370 FM= 12-2 Za cos²30°

Fig.16. The surface Brillouin zones of the three low-index faces of FCC and BCC lattices.

SURFACE BRILLOUIN ZONES

出面に関し偶対称であるから、Aが検出面に平行 (偶対称)であるか垂直(奇対称)であるかに よってA・Pは検出面に関し偶対称か奇対称かに なる。遷移モーメントがゼロでないための条件は、 これが鏡映操作によって符号を変えないことであ る。よって、Aが検出面に平行のときは偶対称の 始状態が、Aが検出面に垂直のときは奇対称の始 状態のみが観測されることになる。これら二つの 場合が重なってしまう極限が垂直放出(θ_{ext} = 0)で、**表**2にその場合の選択則が載せてある。 (100)、(110)、(111)面はそれぞれ C₄₀、C₂₀、C₃₀ 対称性を持ち、従って、終状態は全対称の Δ_1 、 Σ_1 、 Λ_1 であることや始状態の対称性などは群論 (一重群)が教える通りである。 図18に表 2 の選択則の適用例を示す。 p 偏光 (A_⊥+ A_⊥) と s 偏光 (75%A_⊥)の励起光で測 定したCu(111)面の垂直放出スペクトルを比較 している ($\pi \omega = 12$, 20, 26 e V)。²¹⁾三個の ピークがあるが,強度は = 2.5~-3eVのA₃対称 性のピークで規格化している。 = 0.4eVの表面準 位のピーク強度は p 偏光の場合の方が大きいから, この表面準位はA₁対称性であることがわかる。 = 3.5~-4 eVのピークは、 $\pi \omega = 12eV \ge 20eV$ の場合は p 偏光の方で強度が大きいからA₁対称 性の始状態からの放出と結論されるが、 $\pi \omega = 26$ eVの場合は主にA₃対称性の始状態からのものと 言える。

原子番号の大きい元素から成る固体の場合、ス



Fig.17. Relationship between the bulk Brillouin zones and the surface Brillouin zones for the three low-index lattice planes in FCC and BCC lattices.



Fig. 18. Polarization-dependent normal-emission spectra of Cu (111) at $\hbar \omega = 12$, 20, and 26eV.

ピン-軌道相互作用が大きいから、二重群の表現 (既約二価表現)を使わねばならない(既約一価 表現にスピン演算子 $\Delta_{\mathfrak{s}}$ や $\Lambda_{\mathfrak{s}}$ を掛けて作る;例え ば、 $\Delta_{I} \times \Delta_{G} = \Delta_{G(II)}$)。表面に垂直入射した右 円偏光が励起光である場合の相対論的な選択則を 表3に示す(Δ軸, Σ軸, Λ軸上の電気双極子遷 移に対するもの)。光子は量子数1の内在的角運動 **量**(スピン)を持っているが,円偏光した光子は 伝播方向に+1または-1のはっきり決まった角 運動量を持つ。+1か-1かは偏光が右回りか左 回りであるかによる。表でα,βはそれぞれ光電 子のスピンが運動量 p に平行,反平行であること を意味するから、左円偏光の場合は $\alpha \rightarrow \beta$, $\beta \rightarrow$ αと交換すればよい。(001) 面, (111) 面からの垂 直放出の場合,終状態はそれぞれ $\Delta_{6(1)}$, $\Lambda_{6(1)}$ である。一方,(110)面の場合は制限がない。 C₂,対称(Σ軸)では,全ての既約一価表現の混 合により一個の既約二価表現が作られ、原理的に

は全ての状態が垂直放出で観測可能となる(その ため、表ではα、βの代わりに*を用いた)。光 電子のスピンの向きはモット検出器または低速電 子回折型検出器で決定する(参考文献11,12中の 引用文献参照)。

5.3 測定の幾何学的配置

(110) 面を例にとり,励起光が直線偏光の場合に可能な三種類の測定配置を図19に示した。測定配置は5.2節の選択則に則っている。図19をよく見る前に,光の入射角度 θ_i (表面垂直から測る)を変えると p 偏光のベクトルポテンシャルの表面垂直成分 A_\perp と表面平行成分 A_\parallel の大きさがどのように変化するかを調べておく。

前に述べたように,表面では表面光電効果を誘 起する局所的電磁場が存在しているが、プラズマ 振動より大きいエネルギーの励起光の場合は重要 でないし(吸着分子からの光電子放出に対しては 常に重要でない)、取り扱いが面倒であるから, この現象を無視する [(5)式の▽・A項無視]。表 面における電磁場を古典的に扱い、フルネルの式 を使って, A」とA」を求める。図19に対応させて, 入射項はp偏光で入射面は(110)鏡映面に平行 とする。さて, А 」とА, の 大きさは入射角および 固体の誘電率 ε_1 (ω) +i ε_2 (ω) に依存する。 例として、 $\hbar \omega = 30 eV \sigma ber \delta eV \sigma$ ら求めたA ²とA ²の入射角依存性を図20に示す。 この依存性は、定性的には一般的なものである。 入射角 θ_i が0°のときAは100%A」となるが、 これは入射面が(001) 鏡映面の s 偏光と同じで ある。しかし,どのθ_i値でも100%A₁の場合は ないことを強調しておく。θ,を大きくしてゆく とA」²は最初増大するが、直に頭打ちとなる。こ れは入射波と反射波が定常波を作るからである。 $\theta_i \neq 0^\circ$ の場合,必ず $A_i \ge A_i$ は混じるが, A_1^2/A_1^2 が最大になるのは $\theta_i = 50^\circ \sim 70^\circ$ である (誘電率に依存)。また、θ_i≤15°なら、実質的 には純粋にA」だけとしてよい。

Table 3. Relativistic dipole selection rules for the △, ∑, and ∧ symmetry lines of the cubic lattice with normally incident right-circularly-polarized light.

相対論的双極子遷移選択則 (右円偏光,立方格子)

△軸上での遷移

	△6 (1)	Δ7 (2)	Δ _{7 (2} ,)	△ 6 (E)	△7 (5)
Δs m	· _	57	-	α	β
Δ7 (2)	-	T 3	-	β	a
△ ? (2*)		-		β	α
∆ _{6 (5.)}	β	а	α	-	
⊿, (5)	α	β	β	-	1

Σ軸上での遷移

始状態\終状態	Σ 5 (X. 4)	Σ s (1, 2)	Σ = (3, 4)	Σ 5 (1. 2)
Σ 8 (1)		-		-
Σ 5 (2)	124	-	*	
Σ 5 (3)			-	-
Σ 5 (4)	-	-		

∧軸上での運移

始状態\終状態	Λ 6 (1)	Λ (2)	Λ + (3) Λ 5 (3)	Λ 6 (3)
Λ ε (1)		-	β	α
Λ 6 (2)	-	-	β	α
Λ 4 (3) Λ 5 (3)	а	α	-	β
Λ 6 (3)	β	β	α	-

図19に戻る。励起光がp偏光であるときの,垂 直放出,偶対称配置の斜め放出,奇対称配置の斜 め放出の三つの場合が描いてある。垂直放出の配 置については、5.2節で述べたことから理解でき るであろう。偶対称配置の斜め放出の場合,光の 入射面と光電子の検出面は同一の鏡映面内にある。 つまり,A₁とA₁はともに検出面にあり,検出面 = 鏡映面に関し偶対称である。表1によると,偶 対称の始状態のみが観測される。一方,奇対称配 置の斜め放出の場合は,光電子の検出面を光の入 射面と直交する別の鏡映面にとる。このとき、検 出面に関しA_⊥は偶対称だが、A_□は奇対称である ことに注意して欲しい。 $\theta_{, \neq 0^{\circ}}$ の場合は偶奇両 方の対称性の始状態が観測されるが、 $\theta_{, = 0^{\circ}}$ の ときは、A_⊥=0であるから、奇対称の始状態のみ が観測される。

5.4 表面準位

固体表面(真空-固体界面)では三次元の周期 性が失われているため、バルクのものとは別種の







Fig. 20. Calculated relative components of polarization (A_{\perp}^{2} and A_{\parallel}^{2}) as a function of the angle of incidence of p-polarized light.

電子準位が存在し得る。これは表面準位と呼ばれ、 図21(a)に示すように、真空側と固体側の両側で 減衰する波動関数を持つ(普通、真空準位E_{sac} 以下の束縛準位を指す)。清浄表面の表面準位を 真性表面準位とよび、秩序吸着面の外因性のもの と区別する。表面準位が、表面に射影されたバル クバンド(PBB;(b)の斜線部)と重ならないとき 表面(束縛)準位[surface state;ss],重なると き表面共鳴(準位)[surface resonance;sr]と呼 ばれる。真空準位より上では真空側の波動関数 (平面波)が表面近傍に侵み込むが、バルクのブ ロッホ波とうまくつながる場合は表面共鳴となる。 うまくつながらなくてすぐ減衰する場合は減衰状 態(evanescent state)となることは前に述べた。 表面準位にはタム型とショックレー型がある。





Fig.21 . (a) Different types of wave functions at surface. (b) Schematic illustration of surface states (ss) and surface resonances (sr) in hypothetical $\varepsilon - k_{\parallel}$ band-structure diagram.

タム準位は、表面原子のポテンシャルがバルク内 原子のポテンシャルとかなり異なるためにバルク バンドから分離した束縛準位で(バンドの曲がり の効果ともみなせる)、バンドの幅が狭い場合や 状態密度の端が切り立っていて表面のポテンシャ ルが大きい場合に形成される。ショックレー準位 は、表面とバルクのポテンシャルがあまり違わな いときにも、バルクでのバンドギャップ生成の条 件が表面で失われるために(半導体の場合、直観 的には, 表面原子の電子結合が切断されるため. と考えてもよい)出現するもので、ブリルアン ゾーン境界でのギャップ内やバンドとバンドの交 差による混成ギャップ内に存在する。要するに, 境界条件の違いからバルクバンドギャップ中に許 されるようになったシュレーディンガー方程式の 解がショックレー型の表面準位である。半導体表 面のダングリングボンドや金属表面のsp-表面準 位はショックレー型、Cu3dバンド直上にあるd-表面準位はタム型の例とされている。

表面準位からの光電子放出をバルクバンドから

のものと実験的に区別するのは容易ではないが、 下記の三つの条件が役に立つ。

表面準位の判定条件:

- (1) 表面準位は二次元性をもつから, k_{\perp} 分散は ない。従って, k_{\parallel} を一定に保って $\pi \omega$ だけ変 えてもそのピーク位置は変わらない。
- (2) 表面準位は表面の完全さ、清浄さに敏感である。従って、表面の結晶性を損ねたり、表面に何かを吸着させて汚染すると、表面準位は消失する。
- (3) 表面準位はPBB構造のギャップ内にある。

幾つか注意すべきことがある。条件(1)は必ずしも 表面準位を保証しない。バルク準位からの光電子 放出で,自由電子状態に近似できる終状態が存在 しないときは(我々は,それが存在しているのか どうか,予め知らされてはいない),光電子の放 出方向に沿った一次元状態密度の構造が観測され, これはħωに対し分散を示さないからである。次 に,条件(2)についてであるが,どの物質の吸着に も表面準位は消失するという保証はないし,表面 の不秩序や汚染によってバルク準位からの光電子 放出ピークも敏感に消失する例が知られており, 注意が必要である。表面共鳴は条件(3)を満たさな いし,バルク状態と強く混じると幅が広がるから 観測しにくくなる。また,振幅が表面で増幅され たバルク状態と表面共鳴の区別はあいまいである。 要するに,(1)-(3)の条件に頼って表面準位のピー クを先に同定するのは得策ではない。三つの条件 に反するバルク準位からのピークを先に探して, 残りのピークを検討するのが常道である。

6.さいごに

本稿はバンドマッピングする角度分解光電子分 光法の原理に話の重点をおいたため、金属清浄表 面への僅かな応用例しか紹介しなかったし、吸着 面や半導体表面の話は一切しなかった(1985年ま での研究例は文献8,29参照)。半導体の場合, 表面再配列や表面欠陥の問題があって研究は著し く遅れている。SiやGeといった代表的な半導体 ですらバルクバンドのマッピングはなされていな い。表面状態を規定しない多結晶試料で調べられ てきた興味ある物質や新しく開発される新機能物 質などと併せ今後の課題である。ここで注意した いのは、光電子分光は表面という窓口を通して情 報を得ざるをえないため、否応なく表面研究をし ているのだ、ということである。最後に、測定試 料さえ用意すれば角度分解紫外光電子分光実験を 実施できる我が国唯一の装置が高エネルギー物理 学研究所の放射光共同利用実験施設にあること, また、分子科学研究所と東京大学物性研究所でも 近い将来実施できる可能性があることを付言して おく。

文 献

- 1)相原淳一他著,共立化学ライブラリー16電子の分 光(共立出版,1978).
- 2)小間 篤他編,表面物性工学ハンドブック(丸善, 1987).
- 3) M. Cardona and L. Ley(eds.), Photoemission in Solids I, II (Springer-Verlag, 1978, 1979).
- 4) B. Feuerbacher and R. F. Willis, J. Phys. C9, 169 (1976).
- 5) B. Feuerbacher, B. Fitton, and R. F. Willis (eds.), Photoemission and the Electronic Properties of Surfaces (Wiley, 1978).
- 6) Y. Petroff and P. Thiry, Applied Optics 19, 3957 (1980).
- 7) F. J. Himpsel, Applied Optics 19, 3964 (1980).
- 8) E. W. Plummer and W. Eberhardt, Advan. Chem. Phys. 49, 533 (1982).
- 9) R. Courths and S. Hüfner, Physics Reports112, 53 (1984).
- 10) 佐川 敬, 小林悌二, 日本結晶学会誌20, 116(1978).
- 11) M. Campagna, Physica 127B, 117 (1984); J.
 Vac. Sci. Technol. A3, 1491 (1985).
- 12) U. Heinzmann, Physica Scripta T17, 77(1987).
- 13) W. F. Krolikowski and W. E. Spicer, Phys. Rev. 185, 882 (1969).
- 14) P. J. Feibelman and D. E. Eastman, Phys. Rev. **B10**, 4932 (1974).
- A. Goldmann, A. Rodriguez, and R. Feder, Solid State Commun. 45, 449 (1983).
- 16) H. Wern and R. Courths, Surface Sci. 152/
 153, 196 (1985).
- 17) P. F. Kane and G.B.Larrabee (eds.), Characterization of Solid Surfaces (Plenum Press, 1974).
- 18)日本化学会編,新実験化学講座18界面とコロイド (丸善,1978).

19) 鈴木 洋, 脇谷一義, 日本物理学会誌28, 705(1973).

-93-

- 20) S. D. Kevan, Phys, Rev. Lett. 50, 526 (1983).
- 21) J.A.Knapp,F.J.Himpsel and D.E. Eastman, Phys. Rev. B19, 4952 (1979).
- 22) P. Heimann, H.Miosga, and H.Neddermeyer, Solid State Commun. 29. 463 (1979).
- 23) N. E. Christensen, Solid State Commun. 38, 309 (1981).
- 24) R.Courths, Solid State Commun. 40, 529(1981).
- 25) E. Dietz, F. J. Himpsel, and D. E. Eastman, Phys. Rev. Lett. 41, 1674 (1978).
- 26) J. G. Nelson, S. Kim, W. J. Gignac, R. S.
 Williams, J. G. Tobin, S. W. Robey, and D.
 A. Shirley, Phys. Rev. B32, 3465 (1985).
- 27) M. A. Mueller, A. Samsavar, T. Miller, and
 T. -C. Chiang, Phys. Rev. B40, 5845(1989).
- J. Hermanson, Solid State Commun. 22, 9 (1977).
- 29) 匂坂康男, 分光研究35, 337 (1986).

きっしゅ

固体表面(solid surface)

清浄表面の場合は最外の原子層ただ一層を指す。単 原子層以下の吸着子(原子・分子)が存在する場合は、 固体の最外原子層と吸着子層の二層を表面と呼ぶ。表 面より下の数原子層で、電子構造や結晶構造がバルク とは異なる領域を表面層(selvedge)と呼び、表面と は区別する。

清浄表面(clean surface)

理想的表面(思考的な劈開面)と実在表面に分類さ れる。実在表面には清浄化はしたが清浄さを調べてい ない cleaned surface と清浄さを確認した原子的清 浄表面(atomically clean surface)とがある。原子 的清浄表面とはオージェ電子分光の検出限界(単原子 層の0.1%以下)内で不純物が検出できない表面をい うが、これに表面の結晶性の良さ(平滑な単結晶面) の意味も含めるのが普通である。

表面再配列(surface reconstruction)

表面の原子は片側の最近接原子がないため、表面近 傍の原子配列は固体内部とは一般に異なる。その変化 が固定内部の表面に平行な格子面に沿っての二次元対 称性を変えるようなものである場合、表面再配列と呼 ばれる。一方、固体内部の二次元対称性は変えない (面内の一様なシフトもない)が、表面に垂直方向の面 間隔のみ変えるような構造変化は表面緩和(surface relaxation)と呼ばれる。

表面準位(surface state)

表面近傍にのみ存在する一電子準位で、バルクバン ドのギャップ内にできる。エネルギー的にバルクの準 位と重なって混じりがあるものは表面共鳴(状態) [surface resonance(state)]と呼んで区別する。 吸着子の電子準位に基づくものは表面準位とは通常呼 ばない。表面準位は表面の物性を支配する重要な因子 であり、表面の化学的活性にも深く関係する。境界条 件の違いからギャップ内で許されるようになったシュ レーディンガー方程式の解をショックレー型表面準位、 表面でのポテンシャルがバルクと大きく異なるために 出現するものをタム型表面準位と呼んで区別すること がある。また、このような結晶ポテンシャルに起因す るもの以外に、金属表面のすぐ外側の電子に働く鏡像 力によって真空準位直下にできる鏡像力表面準位があ る(逆光電子分光で観測できる)。

表面光電効果(surface photoelectric effect)

表面放出(surface emission)

-95-

外部(真空側)平面波の固体内侵み込み部分を終状態 とする光電子放出。この場合,バルクの電子準位とう まく接続されている外部平面波は除外し(バルクの過 程として扱える),うまく接続できず固体内ですぐ減 衰するもの(evanescent state)に限定する。二次電子 分光ではバンドギャップ放出(band gap emission) として知られる。

